

～目次～

第一章 序論

- 1.1 まえがき
- 1.2 EDT システムの動作原理
- 1.3 ベアテザーの概要とその問題点
- 1.4 本研究の目的

第二章 研究手法

- 2.1 各種試験概要
- 2.2 試験システム概要
 - i) 負バイアス試験
 - ii) 正バイアス試験
- 2.3 試験装置
- 2.4 供試体
 - i) アルミテザー
 - ii) ステンレステザー
- 2.5 試験サンプル形状

第三章 試験結果

- 3.1 結合部放電抑制試験
- 3.2 ステンレスベアテザー性能評価試験
 - i) 負バイアス試験
 - ii) 正バイアス試験
- 3.3 結合部放電閾値比較試験

第四章 ベアテザーの変色原因とその影響の調査

- 4.1 ベアテザーの変色
- 4.2 アルミ板変色試験
- 4.3 表面分析結果
 - i) SEM-EDS
 - ii) XPS
- 4.4 変色・非変色ベアテザー電流収集能力比較試験

第五章 総括

- 5.1 総括
- 5.2 今後の課題

※全文を希望の方は cho アット ele.kyutech.ac.jp までご連絡下さい